

A parametrized numerical model to simulate the semiconductor influence of thick film metal oxide gas sensors

February 24, 2020

Dissertation

der Mathematisch – Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Eberhard Karls Universität Tübingen
zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat.)

vorgelegt von
Peter Bonanati

Tübingen
2020

Tag der mündlichen Prüfung:

xx.xx.2020

Dekan:

Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel

1. Berichterstatter:

Prof. Dr. Udo Weimar

2. Berichterstatter:

Prof. Dr. Reinhold Fink